

III. DONNEES STATISTIQUES

III.1. NOMBRE DE CANDIDATS

21803 candidats se sont inscrits à l'épreuve. **16990** admissibles ont été convoqués. **15403** candidats ont été accueillis suite à l'appel de la boîte vocale leur donnant leur heure de passage.

15250 candidats se sont effectivement présentés à l'épreuve soit **89.8%** des admissibles. Leur répartition par filière est la suivante :

Filière	Nombre de candidats	Pourcentage
MP	5263	34,5 %
PC	4162	27,3 %
PSI	3727	24,45 %
PT	1661	10,9 %
TSI	414	2,7 %
TPC	23	0,15 %
TOTAL	15250	100

Répartition des candidats admissibles par concours :

CONCOURS	Nombre de candidats
CCP	12078
Centrale-Supélec	6275
Mines-Ponts	3494
Banque PT	1812
CONCOURS CLIENTS⁸	
Concours Commun TPE	2869
INT	4432
<i>EFREI</i>	<i>630</i>
ENSAM	1369
ESTP	2990
Polytech	5472

8

INT : Institut National des télécommunications, ISMEA (Ingénieurs spécialisés en microélectronique et Applications), ESIEE (École Supérieure d'Ingénieurs en Électronique et Électrotechnique)

EFREI (Ecole Française d'Electronique et d'Informatique)

EME Bruz (Ecole des Métiers de l'Environnement)

ENSAM (Ecoles Nationales Supérieures des Arts et Métiers)

ESTP (Ecole Supérieure des Travaux Publics)

III.2. RÉSULTATS DE L'ÉPREUVE

III.2.1. STATISTIQUES PAR FILIERE

MOYENNES SUR 20 OBTENUES SUR L'ENSEMBLE DE L'ÉPREUVE

	Moyenne	Écart type	Nombre de candidats
MP	11,53	3,62	5263
PC	11,59	3,43	4162
PSI	11,33	3,37	3727
PT	11,03	3,42	1661
TSI	9,83	3,74	414
TPC	10,55	3,48	23
Moyennes et écarts-type globaux/Total	10,97	3,51	15250

Moyenne et écart-type PARTIE C

	Moyenne	Écart type	Nombre de candidats
MP	11,38	4,17	5263
PC	11,37	4,08	4162
PSI	10,97	4,09	3727
PT	10,65	4,23	1661
TSI	9,33	4,58	414
TPC	9,82	4,6	23
Moyennes et écarts-type globaux/Total	10,58	4,29	15250

Moyenne et écart-type PARTIE D

	Moyenne	Écart type	Nombre de candidats
MP	11,46	3,82	5263
PC	11,58	3,49	4162
PSI	11,45	3,4	3727
PT	11,19	3,45	1661
TSI	10,34	3,85	414
TPC	11,01	3,31	23
Moyennes et écarts-type globaux/Total	11,17	3,55	15250

III.2.2. DIAGRAMME DE DISTRIBUTION DES NOTES



